第 15 回放射線による非破壊評価シンポジウム

主　催：(一社)日本非破壊検査協会　放射線部門
協　賛：依頼中
期　日：2026 年 3 月 2 日(月) 13：00～18：10　(受付 12：00～)
会　場：日本非破壊検査協会　亀戸センター6 階 B 会議室
東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル

参加費： (講演論文集 1 冊を含む)	JSNDI 正会員		4、000 円
	登壇者		4、000 円
	学生会員		3、000 円
	協賛学会会員		6、000 円
	非会員	一般	8、000 円
		学生	4、000 円

申込方法：以下 Web 参加申込ページからお申込みください。
https://sciences.jsndi.jp/radiographic/
問合先：(一社)日本非破壊検査協会 放射線シンポジウム係
TEL：03-5609-4015　E-mail：yasoshima@jsndi.or.jp

講演時間：一般講演 30 分 発表 25 分、質疑応答 5 分
特別講演 40 分 発表 35 分、質疑応答 5 分

ープログラムー

開会挨拶　(13:00～13:03)
放射線部門主査　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）

1. 一般講演: 放射線による非破壊検査　(13:03～15:05)
座長　田北雅彦((株)IHI 検査計測)
1-1　熱交換器管端溶接部の内在きずへの X 線透過試験と中性子線 CT 法の適用
新日本非破壊検査(株)　○今川幸久

1-2　Ir-192 球状線源とディスク状線源の像質比較試験
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一
(株)千代田テクノル ○石井　貴
(株)IHI 検査計測 田北雅彦

1-3　Se-75 線源の配管撮影への適用（フィルム編）
ポニー工業（株） ○水野　優
羽部達矢、釜田敏光
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一

1-4　Se-75 線源の配管撮影への適用（ベンダブル DDA 編）
ポニー工業(株) ○羽部達矢
水野　優、釜田敏光
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一

休憩（15:05～15:13）

2. 特別講演　(15:13～15:55)
座長　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）
2-1
(国研)理化学研究所 ○大竹淑恵、小林知洋
池田裕二郎、今城想平
草野広樹、水田真紀
東京科学大学 池田翔太

休憩（15:55～16:03）

3.一般講演:X 線による非破壊検査　(16:03～18:05)
座長　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）
3-1　CAD モデルを用いた X 線マイクロ CT 用金属アーチファクト低減
(株)島津製作所 ○森本直樹
陳　澤政、小林哲哉
謝　志敏、小島佳奈
高橋　亮、欅　泰行

3-2　ISO 規格に基づく幾何学的不鮮鋭度 Ug および RT-D における基本空間分解能 SRb の関係に関する考察
富士フイルム(株) ○成川康則

3-3　高エネルギーX 線撮像に基づくコンクリート内部構造評価手法の高度化
東京大学 ○馬　昭、杉田彰夫
安倍昌宏、神近祐平、長谷川秀一
(株)高速道路総合技術研究所 宮永憲一
守口良平、藤田恭介
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 小塚正博

3-4　機械学習を活用した高エネルギーX 線による橋梁内部の認識手法についての検討
東京大学 ○神近祐平、杉田彰夫
安倍昌宏、 馬　昭、長谷川秀一
(株)高速道路総合技術研究所 宮永憲一
守口良平、藤田恭介
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 小塚正博

閉会挨拶　(18:05～18:10)
富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）

講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は、事前に登壇者の了承を得た上で、登壇前に座長へ申し出るようにお願いいたします。

会場地図